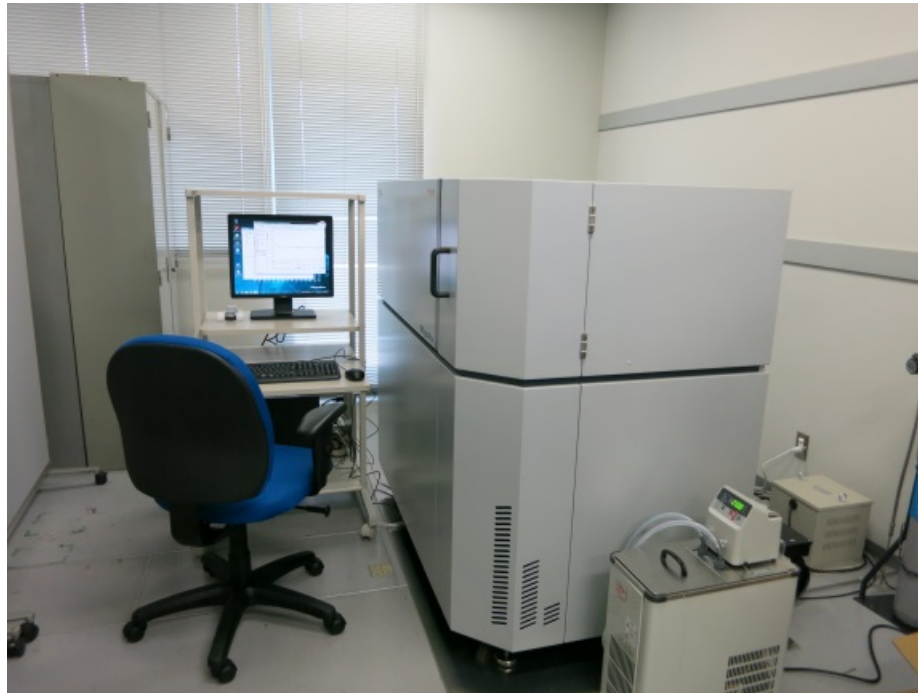


# グロー放電発光分析装置



本装置は、グロー放電で試料をスパッタリングし、スパッタされる原子の発光を連続的に分光することにより、試料表面から約50 $\mu$ mの深さ程度までの元素分布を測定する装置です。

試料を高真空に保持する必要がなく、簡単に短時間で皮膜の表面から深さ方向(数10 $\mu$ m程度)の元素分析ができるという、他の分析機器にない大きな特長を持っています。

本装置は、浸炭・窒化などの表面改質層、多層めっき、複合めっき、表面処理鋼板、ステンレスなどの不動態膜、PVD多層膜、二次電池用電極、太陽電池薄膜などの様々な表面の分析に適用できます。

## 株式会社リガク製 GDA750

- ・測定可能元素: 45元素サンプル (H, Be, B, C, N, O, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ta, W, Pt, Au, Pb, Bi, La, Nd, Dy)
- ・測定試料: 平滑領域が必要、サイズ14mm $\phi$ ~150×150mm(感度調整が必要なため面積が広いほうが良い)
- ・依頼試験料金: 12,800円      ・機器使用料金: 1時間4,600円 (指導料別途要)
- ・問い合わせ先: 上田(2715)、齊藤(2724)